

MEB Hitachi S800 FEG

- Résolution 2 nm à 30 kV pour une distance de travail de 5mm,
- Tensions d'accélération possibles de 1 à 30 kV
- Détection d'électrons rétrodiffusés avec un détecteur Robinson

Accessoires :

- Système de microanalyse EDX avec logiciels IDFix et MaxView de SamX. Possibilité d'acquisition de cartographies spectrales. Détection de tous les éléments à partir du bore.

